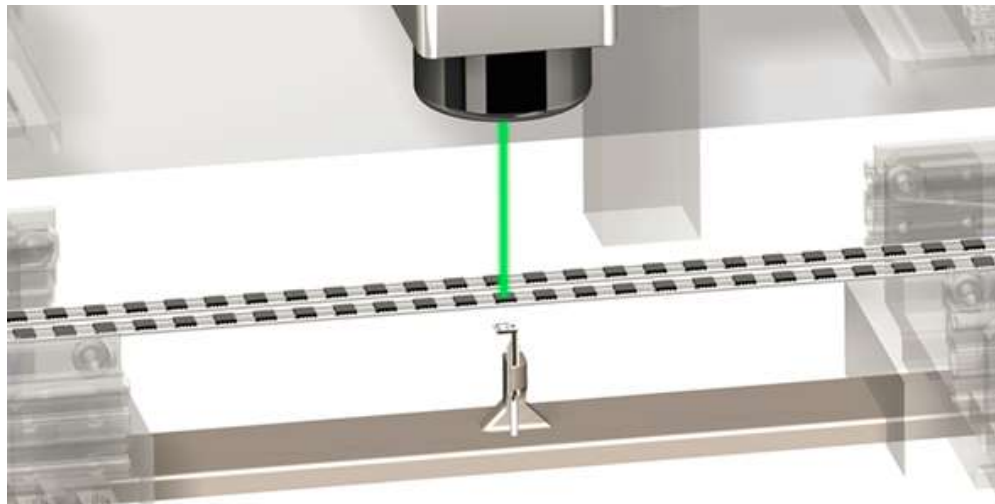


Halbleiterprüfung mit dem Laser Mikrophon

Die einzigartige, laserbasierte Technologie ermöglicht die berührungslose Halbleiterprüfung ohne Wasser oder Koppelflüssigkeit. Die Technologie ist als integrierte Table-Top-Lösung für F&E-Labore oder Forschungsinstitute erhältlich und kann auch direkt in die Produktionslinie integriert werden, um eine 100%-Qualitätskontrolle zu realisieren.



Die Desktop-Station bietet zwei Betriebsmodi für die Ultraschallprüfung von Halbleiterelementen: einen berührungslosen Scan-Modus und den ultraschnellen Single-Shot-Modus für die 100%-Prüfung. Beide Modi ermöglichen die Erkennung von Delaminationen und anderen internen Defekten bei der berührungslosen und zerstörungsfreien Prüfung von Elektronik-Chips. Im Scan-Modus können diese Defekte im Detail lokalisiert und analysiert werden, während der Single-Shot-Modus mit bis zu 1000 geprüften Bauteilen pro Sekunde eine unvergleichliche Geschwindigkeit bietet.

Der Einsatz der Laser Mikrophon-Technologie steigert Ihre Produktivität bei der Fehleranalyse und die Zuverlässigkeit in der Produktion!

Merkmale

- Kompaktes und vielseitig einsetzbares Desktop-Tool oder vollautomatisierte Produktionslinienüberwachung
- 100% Dokumentation
- Einzigartige kontaktfreie Sensortechnologie ohne Koppelmittel
- Keine Beeinflussung von anderen Produktionsschritten
- Schnelles Bildgebungsverfahren für bis zu 10.000 Bildpunkte pro Sekunde
- Einzelschuss Modus für die Prüfung von bis zu 1000 Halbleiterelementen pro Sekunde
- Verknüpfung mit Offline Bildgebung defekter Komponenten zur Analyse möglich